

適用規格																											
定格	使用温度範囲	-45°C ~ + 125°C (注1)		保存温度範囲	-10°C ~ + 60°C (注2)																						
	電圧	AC 50 V		適合コネクタ	DF12#-*DS-0.5V(**)																						
	電流	0.3 A																									
性 能																											
項目	試験方法	規 格			QT	AT																					
外観、構造、仕上げ 表示	目視、寸法測定器にて測定する。 目視にて確認する。	図面と合致していること。			○	○																					
接触抵抗 絶縁抵抗 耐電圧	100 mA (DC又は 1000 Hz) で測定する。 DC 100 V で測定する。 AC 150 V の電圧を 1 分間印加する。	50 MΩ以下 500 MΩ以上 せん絡・絶縁破壊がないこと。			○	—																					
総合挿抜力	適合コネクタで測定する。	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>極数</th><th>挿入力 (N)以下</th><th>抜去力 (N)以上</th></tr> <tr><td>20</td><td>23.4</td><td>2.6</td></tr> <tr><td>30</td><td>27.0</td><td>3.4</td></tr> <tr><td>36</td><td>29.0</td><td>4.0</td></tr> <tr><td>40</td><td>30.6</td><td>4.2</td></tr> <tr><td>50</td><td>34.2</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>60</td><td>38.0</td><td>6.0</td></tr> </table>			極数	挿入力 (N)以下	抜去力 (N)以上	20	23.4	2.6	30	27.0	3.4	36	29.0	4.0	40	30.6	4.2	50	34.2	5.0	60	38.0	6.0	○	—
極数	挿入力 (N)以下	抜去力 (N)以上																									
20	23.4	2.6																									
30	27.0	3.4																									
36	29.0	4.0																									
40	30.6	4.2																									
50	34.2	5.0																									
60	38.0	6.0																									
繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗 : 50 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—																					
耐振性	周波数 10~55 Hz、片振幅 0.75 mm で 3 方向 各 2 時間試験する。	① 1 μs 以上の電気的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—																					
耐衝撃性	加速度 490 m/s <sup>2</sup> 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	① 1 μs 以上の電気的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—																					
定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2°C、湿度 90~95 % 中に 96 時間放置する。	①接触抵抗 : 50 mΩ以下 ②絶縁抵抗 : 500 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—																					
温度サイクル	温度 -65 → 15~35 → 125 → 15~35°C 時間 30 → 10~15 → 30 → 10~15 分 を 5 サイクル 試験する。	①接触抵抗 : 50 mΩ以下 ②絶縁抵抗 : 500 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—																					
半田耐熱性	【リフロー半田付けの場合】 《リフロー部》 MAX 250°C ピーク 220°C 以上 60 秒 以内 《予熱部》 150~180°C 90~120 秒 リフローは同条件にて 2 回まで可能 【手半田（リペア）の場合】 半田ごてで 350°C、3 秒の条件にて半田付け を行う。但し、端子に力を加えないこと。	外観の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。			○	—																					
二酸化硫黄	濃度 10ppm, 96 時間放置する。 (試験規格 : J E I D A - 3 9)	①接触抵抗 : 50 mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。			○	—																					
塩水噴霧	濃度 5 % の塩水、48 時間放置する。	①接触抵抗 : 50 mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。			○	—																					
備考																											
(注1)通電時の温度上昇を含みます。																											
(注2)保存とは基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表し、基板搭載後の無通電状態は、使用温度範囲が適用されます。																											
試験規格の記載のない試験方法は J I S C 5 4 0 2 を適用しています。																											
△の数	訂正記事	設計	検図	年月日																							
△																											
承認				MO.NAKAMURA	05.10.31																						
検図				TS.MIYAZAKI	05.10.31																						
担当				YH.MICHIDA	05.10.31																						
製図				HK.MURAKAMI	05.10.26																						
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC4-163509-06																								
<b>HRS</b>		製品名	DF12(3.5)-*DP-0.5V(86)																								
ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL537			△ 1/1																					